



# TESCAN CLARA

PARA LA CIENCIA DE MATERIALES

UHR SEM para un análisis rápido, preciso y superficie integral a nanoescala análisis de cualquier material



TESCAN CLARA satisface la demanda de imágenes de alta calidad de cualquier muestra, a la vez que ofrece una experiencia de usuario que facilita la obtención rápida de datos y la facilidad de uso mediante la automatización basada en el flujo de trabajo. Con una selección inigualable de métodos de imagen y contraste de ultraalta resolución, TESCAN CLARA es la solución ideal para laboratorios de ciencia de materiales que requieren versatilidad, además de máximo detalle e información de contraste de cualquier muestra, incluso materiales sensibles al campo magnético y al haz.

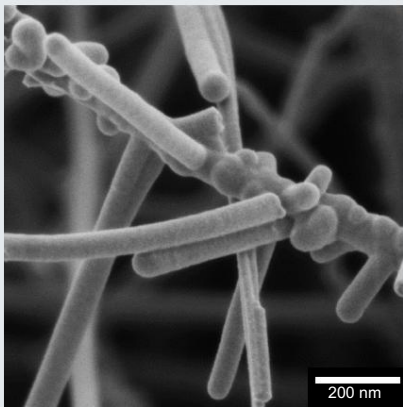


Imagen c UHR SE de Carbono  
Nanotubos fotografiados a 500 eV  
(Muestra sin recubrimiento)

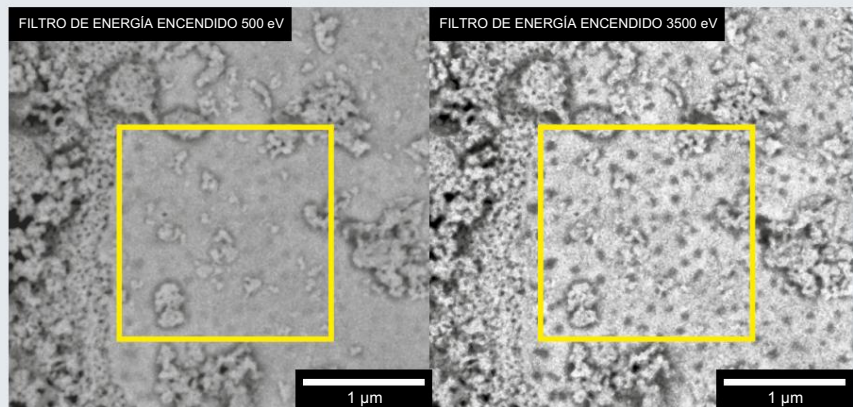


Imagen BSE de polvo sinterizado capturada con el filtro multidetector a 500 eV (izquierda) y a 3500 eV (derecha); Energía de aterrizaje: 4 keV.  
Las nanopartículas ubicadas en la superficie del polvo son claramente visibles.  
utilizando el filtro de energía a 3500 eV

## Beneficios clave:

- Captura detalles de la superficie a escala nanométrica de cualquier material sin preparación de muestra, incluso por debajo de energías de aterrizaje de 1 keV y detección SE en columna de alta eficiencia
- Revela nueva información de contraste y características ocultas con el método único de CLARA para la obtención de imágenes selectivas de EEB, diferenciadas por el ángulo de despegue y la energía, utilizando dos detectores BSE en columna y filtrado de energía
- Obtenga imágenes de ultra alta resolución y sin campo con la máxima información topográfica, incluso de muestras grandes o magnéticas, utilizando la tecnología BrightBeam™
- Realice la nano-topografía definitiva  
Caracterización a las energías de aterrizaje más bajas mediante la combinación de la tecnología BrightBeam™ de CLARA y las tecnologías opcionales de desaceleración del haz



Configure rápidamente los parámetros del haz para obtener imágenes óptimas y condiciones analíticas utilizando Trazado de haz en vuelo™ de TESCAN

Llegue a áreas de interés de forma rápida y precisa con Óptica de campo amplio™ y controles automatizados In-Flight™

Mueva las muestras con confianza y evite colisiones utilizando el exclusivo modelo de colisión 3D en vivo de TESCAN, que replica el tamaño y la geometría de las muestras y los detectores dentro de la cámara.

Revele los detalles topográficos más finos de muestras aislantes, sensibles al haz y desgasificantes en bajo vacío aprovechando el MultiVac opcional, que proporciona el detector de electrones secundarios gaseosos (GSD) y una atmósfera de vapor de agua adicional .

Amplíe su investigación utilizando recursos opcionales Accesorios de caracterización avanzados como RAMAN integrado, etapa de tracción, etapas de calentamiento o imágenes de caras de bloques en serie (SBFI)

Obtenga nuevos conocimientos sobre sus materiales aprovechando Detectores BSE y CL integrados TESCAN

Permita que todos los usuarios, ya sean principiantes, avanzados o expertos, logren los mejores resultados de imágenes y análisis con el software Essence™, que cuenta con flujos de trabajo guiados y personalizables y automatización centrada en tareas.

Diseñe sus propios experimentos y rutinas analíticas aprovechando las ventajas del hardware y software de acceso abierto de TESCAN

